AUG 3 0 2005 50

NCENTRATION MEASURING METHOD BY USING LASER TYPE GAS SENSOR

Publication Number: 02-017429 (JP 2017429 A), January 22, 1990

Inventors:

- SAWADA AKIRA
- DOI SHOJI
- SUGIYAMA IWAO

Applicants

• FUJITSU LTD (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application Number: 63-168077 (JP 88168077), July 05, 1988

International Class (IPC Edition 5):

• G01N-021/39

JAPIO Class:

• 46.2 (INSTRUMENTATION--- Testing)

JAPIO Keywords:

- R002 (LASERS)
- R131 (INFORMATION PROCESSING--- Microcomputers & Microprocessers)

Abstract:

PURPOSE: To make the optical system of an apparatus compact by using one laser light source without using many expensive laser sources.

CONSTITUTION: One laser light source Lo which emits light in a wavelength region wherein absorption lines of (n) kinds of gas species are presents is arranged. The laser light emitted from the laser light source Lo is split. The split laser light beams are transmitted through a cell for gas to be measured and (n) pieces of reference cells N(sub 1)-N(sub n) each containing one kind of (n) kinds of the gas species. An absorption spectrum each comprising (i) points is obtained. The signal value of each point is obtained by using the reference cells N(sub 1)-N(sub n). The inverse matrix 1/(BXA) of the product BXA of a matrix A comprising (i) raw and (n) column with said signal values as elements and the transposed matrix B of said matrix is computed. The signal value of each point is obtained by using the gas to be measured, and the product BXC of a matrix C comprising (i) raws and one column and a transposed matrix B is computed. Furthermore, 1/(BXA)X(BXC) is computed. In this way, the concentrations of the (n) kinds of the gas species incorporated in the gas to be measured can be computed. The optical system of the apparatus can be made compact. (From: *Patent Abstracts of Japan*, Section: P, Section No. 1028, Vol. 14, No. 160, Pg. 128, March 28, 1990)

JAPIO

© 2005 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 3041929

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-17429

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)1月22日

G 01 N 21/39

7458-2G

寒杏請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 レーザ方式ガスセンサによる濃度測定方法

> ②特 頤 昭63-168077

願 昭63(1988)7月5日 22出

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 田 充 ⑫発 明 澤

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 正二 ⑫発 明 者 肥 土

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 巌 72発 明 者 ш

富士通株式会社 顋 勿出

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 井桁 何代 理 人 貞一

明細數

1. 発明の名称

レーザ方式ガスセンサによるガス濃度測定方法

2. 特許請求の範囲

波長可変のレーザ光源より放射されるレーザ光 を被測定ガス中に透過させ、その透過光のスペク トル強度を光検知器によつて進気信号に変換し、 その電気信号に基づいて前記被測定ガスの濃度を 算出して検出するレーザ方式ガスセンサにおいて、 n種のガス様の吸収線が存在する波長領域で発光 する1個のレーザ光源を配置し、該レーザ光源か ら放射されるレーザ光を分割して、分削したレー ザ光それぞれを被測定ガスセルおよび前記n種の ガス種の1種を収容したn個の参照セルに透過さ せて、各々のiポイントからなる吸収スペクトル を求め、

$$\begin{bmatrix}
\Sigma_{j}^{1} & (X_{1,j})^{2} & \cdots & \Sigma_{j}^{i} & (X_{1,j} & X_{n,j}) \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
\Sigma_{j}^{i} & (X_{n,j} & X_{1,j}) & \cdots & \Sigma_{j}^{i} & (X_{n,j})^{2}
\end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix}
\Sigma_{j}^{i} & (X_{1,j} & Y_{j}) \\
\Sigma_{j}^{i} & (X_{2,j} & Y_{j}) \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
\Sigma_{j}^{i} & (X_{n,j} & Y_{j})
\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}
a_{1j} \\
a_{2j} \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots
\end{bmatrix}$$

(但し、X.,, ~X.,, は参照セルを透過したス ペクトル信号値、Y」~Y。は被測定ガスセルを 送過したスペクトル信号値、 a , ~ a , は n 種の ガス濃度)

なる演算をおこなつて、前記被測定ガスに含まれ る前記n種のガス種の濃度を算出するようにした ことを特徴とするレーザ方式ガスセンサによるガ ス濃度測定方法。

3. 発明の詳細な説明

.(概 製)

レーザ光を用いて複数ガス縦の濃度を検知する レーザ方式ガスセンサによるガス濃度測定方法に 関し、

1個のレーザ光波を用いて光学系を小型化する ことを目的とし、

レーザ光源より放射されるレーザ光を被測定ガス中に透過させ、その透過光のスペクトル強度を 光検知器によつて電気信号に変換し、その電気信 号に基づいて前記被測定ガスの濃度を算出して検 出するレーザ方式ガスセンサにおいて、

n 種のガス様の吸収線が存在する波長領域で発光する 1 個のレーザ光線を配設し、該レーザ光線から放射されるレーザ光を分割して、分割したレーザ光それぞれを被測定ガスおよび前記 n 種のガス 種の 1 様を収容した n 個の参照 セルに透過させて、各々 i ポイントからなる吸収スペクトルを求め、

が他のガス種と区別がつき易い波長領域を選んで、その波長領域のスペクトル強度を測定し、かな良 領域を選んで、そのような波長 領域を発光するレーザ光源を用いて、それぞれ n 個のスペクトル強度を測定する。そうして、得られたスペクトル信号値の行列を演算装置によつて 求める。一方、各々のガス種の既知濃度のスペクトル信号値を測定して、その信号レベルと既知濃度 度との比を n 行 n 列の行列で求め、その逆行列を 計算して補正係数とし、その補正係数の逆行列を 前記の行列に乗算して補正し、そのようにして、 n 種のガス種の濃度を算出していた(特別昭 62-230251号参照)。

しかし、そのような濃度測定方法によれば、重なりの様子が異なつて区別がつき易い複数の波提 領域におけるスペクトルを測定するために、被測定ガスの種類だけ波長の異なるn個のレーザ光源を多数使用して、ガスセンサ装置の光学系が大型化する欠点があつた。

参照セルを用いて得た各ポイントの信号値を製装としたi行n列の行列Aと、該行列の転置行列Bとの租B×Aの逆行列1/(B×A)、および被測定ガスを用いて得た各ポイントの信号値を要素とするi行1列の行列Cと前記転置行列Bとの租B×Cを計算し、更に1/(B×A)×(B×C)なる演算をおこなつて、前記被測定ガスに含まれる前記n種のガス種の濃度を算出するようにしたことを特徴とする。

〔産業上の利用分野〕

本発明はレーザ光を用いて複数ガス種の濃度を 検知するレーザ方式ガスセンサによるガス濃度測 定方法に関する。

(従来の技術と発明が解決しようとする課題)

従来、吸収スペクトルの重なるn種のガス種の各々の濃度を測定する場合、まず、重なりの様子の各々異なるn個所の波長領域における吸収スペクトルを測定する。即ち、n種中の1つのガス種

第 6 図はその従来のガスセンサにおける光学系を示す図で、 L., L.z. …… L。 はレーザ光源, Kは被測定ガスセル, N., N.z. …… N。 は既知の濃度の 1 つのガス様を収容した参照セル, M.I., M

図のように、異なる波長領域をもつた n 個のレーザ光源を設け、区別し易い波長領域をもつ1つのレーザ光源からのレーザ光を被測定ガスと種類、濃度が既知の1つの参照ガスとを比較し、かくして、n 個の参照ガスと比較して、上記したように行列で求め、補正係数の逆行列を集算してn 種のガス種の濃度を算出していた。

本発明はそのような多くの髙価なレーザ光源を 用いることなく、1個のレーザ光源を用いて光学 系を小型化することを目的としたガスセンサを提 案するものである。

(課題を解決するための手段)

その課題は、第1図に示す原理図のように、n

(作 用)

即ち、本発明はレーザの1つのモード(モードホップのない連続的に波長を変え得る領域:20~50人範囲)によつてn個のガス種の吸収スペクトルを測定し、次の信号処理を演算装置によりおこなわせる。

その信号処理の説明を簡単にするためにn=2

が成立する。この式の両辺に、

を掛け合わすと、

になり、

$$\left(\begin{array}{ccc} \overset{\circ}{\Sigma} \chi_{1,.,j} & Y_{1,j} \\ \overset{\circ}{\Sigma} \chi_{2,.,j} & Y_{1,j} \end{array} \right) =$$

の場合について説明する。波長領域をi=100 ボイントに等分割して、N,ガスを収容した参照セルN,による単位温度当りのスペクトル信号値を

$$(X_{1,1}, X_{1,2}, \cdots, X_{1,100})$$

N. ガスを収容した参照セルN. による単位濃度 当りのスペクトル信号値を

$$(X_{2,1}, X_{2,2}, \cdots, X_{2,100})$$

被測定ガスを収容した被測定ガスセルドによる単 位濃度当りのスペクトル信号値を

$$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_{ioo})$$

とし、被測定ガス中のN,ガスとN。ガスの濃度が各々aと b であれば、

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ Y_{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{111} \\ X_{122} \\ \vdots \\ \vdots \\ X_{1100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{211} \\ X_{222} \\ \vdots \\ \vdots \\ X_{2100} \end{pmatrix}$$

なる関係が成立し、これを書き換えると、

$\left(\begin{array}{cccc} \Sigma & (X_1, \ j \)^2 & & \Sigma & (X_1, \ j \ X_2, \ j) \\ \vdots & & & & \vdots \\ \Sigma & (X_2, \ j \ X_1, \ j) & & \Sigma & (X_1, \ j \)^2 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} a \\ b \end{array} \right)$

になる。この式の両辺に、

即ち、逆行列をかけると、

$$\begin{pmatrix}
\Sigma (X_{1,j})^{z} & \Sigma (X_{1,j} X_{2,j}) \\
\Sigma (X_{2,j} X_{1,j})^{z} & \Sigma (X_{2,j})^{z}
\end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix}
\Sigma X_{1,j} & Y_{j} \\
\Sigma X_{2,j} & Y_{j}
\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}
a \\
b
\end{pmatrix}
\dots\dots\dots(1)$$

になる。即ち、

$$(X_{1,1}, X_{1,2}, \cdots, X_{1,100})$$
.
 $(X_{2,1}, X_{2,2}, \cdots, X_{2,100})$.
 $(Y_{1}, Y_{2}, \cdots, Y_{100})$

を測定して、上式の演算をおこなえば被測定ガス 内のN.ガスとN.ガスとの濃度a. りを求める ことができる。

被測定ガスが3種類以上でもハーフミラー、参照セルを増やせば同様であり、ガス種をn、 濃度をa , , a z , · · · · . a n として、

$$\times \left(\begin{array}{c} \Sigma_{j}^{i} & (X_{1}, j, Y_{j}) \\ \Sigma_{j}^{i} & (X_{2}, j, Y_{j}) \\ \vdots & \vdots \\ \Sigma_{j}^{i} & (X_{n}, j, Y_{j}) \end{array} \right)$$

の演算をおこなえば、被測定ガスの濃度を求める ことができる。

上記の演算をおこなえば、レーザの1モードに よつてn 種のガス種の吸収スペクトルを測定でき、

第5図は実測ガスの二次微分スペクトルを例示しており、被測定ガスがエタン (C. H.) とプロパン (C. H.) との2種類であり、第1図(ロパン (C. H.) たのでロパンガスのスペクトル、同図(ロ)は参照セルN。内のエタンガスのスペクトル、同図(ロ)は被測定ガスのエタンガスとプロパン

」つのレーザ光波のみを用いたガスセンサが構成できる。

〔実 施 例〕

以下、図面を参照して実施例によつて詳細に説明する。

例えば、被測定ガスがN、ガスとN。ガスとの 2種類からなり、それぞれがa、bの濃度で含まれているとすると、演算は(1)式でおこなうことができ、第2図に示すガスセンサの光学系の構成になる。なお、第2図において、図中の記号は第1図と同一部位に同一記号が付けてあり、Rはレンズである。

第3 図はスペクトル信号を処理する信号処理回路図を示しており、上記に説明した以外の記号は11.12,13はロックインアンプ回路、21,22,23はパワー測定回路、31,32,33,34,35,36はサンプルホールド回路、40はマルチプレクサ回路、45は A D コンパータ、50は演算装置(マイクロコンピュータ)、55はレーザの制御電源である。本

ガスとを含むスペクトルであつて、このようなスペクトルが 100ポイントに区分されて検知され、上記(I)式より演算・補正されて各々の濃度が検知されるものである。

なお、前記した従来法では二次微分スペクトルの特徴ある2~3ポイントのみを選んで質出していたが、本発明にかかる測定方法では細かく区分した多数ポイントからなるスペクトル波形を描きだして算出することが大きく相違している点であ

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明にかかる濃度測定方法によれば高価なレーザ光源を多数 用いることなく、1個のレーザ光源を用いてレーザ光源および検知器を含む光学系を小型にし、ガスセンサを安価に作成することができる利点の大きいものである。 4. 図面の簡単な説明

第1図は原理図、

第2 図は実施例の光学系を示す図、

第3図は信号処理回路図、

第4図はレーザ電流の変化図、

第5図は実測ガスの二次微分スペクトル図、

第6図は従来の光学系を示す図である。

図において、

L.。はレーザ光源、

Kは被測定ガスセル、

N,~N。は参照セル、

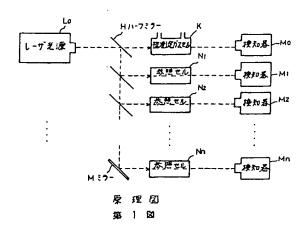
M。~M。は検知器、

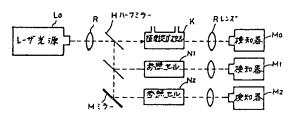
Hはハーフミラー

Mはミラー

を示している。

代理人 弁理士 井桁 貞一





実施例の老学系を末1四 第 2 回

